



中華民國專利證書

發明第 I774237 號

發明名稱：具有碟型反射面的天線量測系統

專利權人：國立臺灣大學

發明人：林昭和、周錫增、邱志偉

專利權期間：自2022年8月11日至2041年2月8日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局局長

洪淑敏

中華民國



111 年 8 月 11 日

